

UDC 620.1.05
L 97



中华人民共和国国家标准

GB/T 15394—94

多探针测试台通用技术条件

General specification for probe tester

1994-12-28 发布

1995-08-01 实施

国家技术监督局 发布

多探针测试台通用技术条件

General specification for probe tester

1 主题内容与适用范围

本标准规定了多探针测试台(以下简称探针台)的术语、技术要求、试验方法、检验规则、包装贮存等要求。

本标准适用于手动、半自动、全自动多探针测试台。其他类型的探针测试台亦可参照使用。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GBn 193 出口机械、电工、仪器仪表产品包装通用技术条件
- GB 2681 电工成套装置中的导线颜色
- GB 2682 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色
- GB 3768 噪声源声功率级的测定 简易法
- GB 5080.7 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案
- GB 5226 机床电气设备通用技术条件
- GB 6388 运输包装收发货标志

3 术语

3.1 探针台 probe station

利用金属探针将晶片上芯片的电极与测试仪联接,以完成芯片电参数中间测试的设备。

3.2 手动探针台 manual probe station

操作步骤全部由人工完成的探针台。

3.3 半自动探针台 semi-automatic probe station

能自动完成除图像识别、自动对准之外的所有其他探测步骤的探针台。

3.4 全自动探针台 fully-automatic probe station

能自动完成包括图像识别、自动对准在内的所有探测步骤,并具有多种功能的探针台。

3.5 探针 probe

具有特定机械电气性能和结构尺寸的金属针。

3.6 测试支架 test support

可在一定范围内分别调节探针的 X、Y、Z 向距离、用以安装固定探针的部件。

3.7 探针卡 probe card

根据被测芯片电极所需探针的数量及布局,将探针对应固定于一块基板上的卡片。

3.8 探边器 edge sensor

用来探测探针是否已测至被测晶片边缘的部件。